WEST

End of Result Set

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 1

File: JPAB

Feb 4, 1987

PUB-NO: JP362026653A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62026653 A

TITLE: LIGHT DETECTOR

PUBN-DATE: February 4, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NITSUTA, SHIGEYUKI TAMATOSHI, KUNIYOSHI HORIUCHI, SHIGEKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

APPL-NO: JP60166510

APPL-DATE: July 26, 1985

US-CL-CURRENT: 369/44.11 INT-CL (IPC): G11B 7/13

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent reflection in the same direction as the incident angle of return light by providing inclination to the return light photodetecting surface of a supporting body corresponding to the edge of the semiconductor laser chip.

CONSTITUTION: A supporting body 22 as the thermal stress relaxing material composed of the rectangular parallelopiped shaped silicon fixed by a semiconductor laser chip 15 inclines, as the shaft, the line to penetrate vertically the bonding surface of the semiconductor laser chip 15 and the supporting body 22 and the bonding surface of a radiator 19 and the supporting body 22, and the inclination is held at a return light photodetecting surface 23 of the supporting body 22 to an edge surface 16 of the semiconductor laser chip 15. Thus, the reflecting light from the return light photodetecting surface 23 of the supporting body 22 is not reflected in the same direction as the incident angle of the return light, and the satisfactory light detecting device can be obtained in which the trouble to the tracking due to the primary light return light is eliminated.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-26653

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987) 2月4日

G 11 B 7/13 7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称 光検知器

> 创特 昭60-166510 豠

昭60(1985)7月26日 22出

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所 仁 田 重 之 72発 明者

内

玉 利 邦 喜 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所 ⑫発 明 者

樹 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所 茂 個発 明 者 堀

内

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 ⑦出 顖

弁理士 大岩 増雄 外2名 つけ 理

1. 発明の名称

光検知器

2. 特許請求の範囲

(1) ディスクに対し半導体レーザ光を端面から出 射する半導体レーザチップと、この半導体レーザ チップが固着される支持体とを備えたものに於て 、上記デイスクから反射された戻り光が描く上記 支持体の戻り光受光面に上記端面に対して傾きを 持たせたことを特徴とする光検知器。

(2) ディスクから反射された戻り光は、ディスク 上のピット個号を脱むための0次光とトラッキン グのずれを脱むための1対の1次光とからなるこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項配職の光機 知器。

(3) 支持体は熱応力機和材であることを特徴とす る特許臍求の範囲第1項または第2項配収の光検 知器。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はデイスクにレーザ光を規射してその 反射光によりデイスクに記憶された内容を脱み収 る光検知器に係り、特に光検知器のトラッキング エラー発生防止に関するものである。

〔従来の技術〕

光ディスクに配録されたピット個号を半導体レ ーザ装置を使用した光検知器〔以下ピックアップ と称す〕で脱み取るコンパクトディスクブレーヤ 等にかいて、本ピックアップには種々の方式のも のが使用されている。第5凶はこのうち3ピーム 方式のものを示した凶であり、この方式は半導体 レーザ装置(1) から出射されたレーザ光(2) をコリメ ートレンズ(3)を介して第6凶に示す回折格子(4)に より1つの0次光(10)と2つの1次光(11)(12)に 分割し、これをピームスプリッタ(5)及び対物レン ズ(6)を介して光ディスク(7)のトラッキング方向に 第7図に示すように照射し、デイスクのから反射 される 0 次光 (10) と 1 次光 (11) (12) の反射光(10a) (11a) (12a) を対物レンズ(6) 及びピームスプリック (5) 並びにレンズ(8) を介して 3 分割 光検知器(9) にて

脱み取るものである。このとき、0 次光 (10) はピット (13) の信号を脱むためのものであり、1 次光 (11)、(12)は対としてトラッキング (14) のずれを脱み調整するためのものである。

ところで、上記した様に通常 0 次光 (10)、 1 次光 (11) (12) はディスク(7)面で反射され光ピックアップ内に設けられた 3 分割光検知器(9) で受けられ、それぞれの目的にしたがい処理されるが、反射された光 (10a) (11a) (12a)の一部には再び半導体レーザ装置(1) に戻つてくるものがある。

第8図にその一例を示す。第8図は従来の半導体レーザ装置(1)の主要部の一例を示すもので(15)は半導体レーザチップ、(16)はその嚙面、(17)はレーザ光の出射点、(18)は半導体レーザチップ(15)が固着されるシリコン等の熱応力殺和材からなる支持体、(19)はこの支持体(18)が固着される放熱体でありこれら半導体レーザチップ(15)及び支持体(18)並びに放熱体(19)はそれぞれの上面が1平面上に信う様接着されている。この様に構成されたものに於ては0次光(10a)はレーザ光の出

ブの増面に対して支持体の戻り光受光面に假針を 持たせたものである。

〔作用〕

この発明においては、支持体の戻り光受光面が 半導体レーザチップの端面に対して傾斜して設け られているから、戻り光が入射角度と同一方向に 反射されることないものである。

[实施例]

1 凶はこの発明の一実施例を示す光検知器の 半導体レーザ装置(1)の斜視図で、図に戻て(15)ないし(17)、及び(19)ないし(21)は上記従来装置と 同く同一のものである。(22)は半導体レーザチンプ(15)が固着される直方体形状のシリコンからなる熱応力機和材としての支持体で、この支持体(22)は、半導体レーザチンプ(15)とこの支持体(22)との接着面とを垂直に貫く線を軸として傾け上記半導体レーザチンプ(15)の端面(16)に対して支持体(22)の戻り光受光面(23)に傾きを持たせたものである。 射点 (17) に戻り、 1 次光の 1 つ(11a) は熱応力殺和材 (18) の上面 (20) [以下、戻り光受光面と称す]に、他の 1 つ(12a) は空間上 (21) に戻ってくるものである。

[発明が解決しよりとする問題点]

上記の様な従来の光検知器に戻ては、1次光(11)の戻り光(11a)の反射面となる支持体 (18)の戻り光受光面 (20)が半導体レーザチップ (15)の喘面 (16)と一平面上に揃り様に構成されているから、上配戻り光(11a)が入射角度とほぼ同一方向に反射されて回折格子(4)に適し、これにより半導体レーザチップ (15)から出射されるレーザ光と干渉し合つて、回折格子(4)を経た光の強度がふらつき、トラッキングに支障をきたすといり問題点があつた。この発明は、かかる問題点を解決するためにな

この発明は、かかる問題点を解決するためになされたもので、1次光の戻り光によるトラッキングへの支障を無くした良好な光検知器を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る光検知器は、半導体レーザチッ

上記の様に様成された光検知器に戻ては、従来と同一形状の支持体 (22) を半導体レーザチップ (15) に対し傾けて取り付けるという非常に簡単な様成により、この支持体 (22) の戻り光受光面 (23) からの反射光が戻り光の入射角度と同一方向に反射されることを無くすことができるものである。

なお、上配実施例に於ては、支持体 (22) を直方体形状のものとしたが第 2 図及び第 3 図に示す様に直方体の上面を斜めに切断した形状のものを半導体レーザチップ (15) 及び放熱体 (19) に付着したの上面に半導体レーザチップ (15) との付着面に向かって ▼字溝が堀り下げられていくような形状のものとしてもり、のであり、要は支持体 (22) の関り光受光面とのであり、要は支持体 (22) の関り光受光面上に無く、任意の傾きをもつていれば良いものである。

〔発明の効果〕

。この発明は以上説明した様に、支持体の戻り光 受光面が半導体レーザチップの端面に対して傾針

特開昭62-26653(3)

して殷けられているから、戻り光が入射角度と同一方向に反射されることはなく、よつて1次光の 戻り光によるトラッキングへの支障を無くした良 好な光検知器が得られるという効果がある。

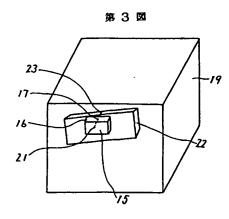
4. 図面の簡単な説明

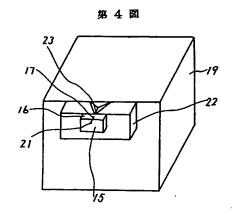
第1図はこの発明の一実施例を示す半導体レーザ装置部の斜視図、第2図ないし第4図はこの発明の他の実施例を示す半導体レーザ装置部の斜視図、第5図は光検知器の全体解配図、第4図は光ディスク上に照射されるレーザ光位置を示す配置図、第4図は従来の半導体レーザ装置部を示す斜視図である。

図に於て、(15) は半導体レーザチップ、(16) は 半導体レーザチップ端面、(22) は支持体、(23) は 戻り光受光面である。

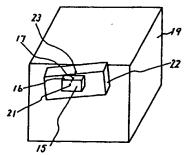
なか、各図中同一符号は、同一または相当部分 を示すものである。

代理人 大 岩 増 雄







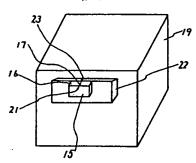


/5: 芋導体レーザチップ /6: 芋導体レーザナップ増面

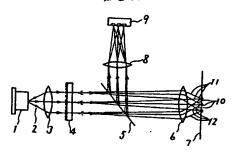
22: 支持体

23. 庆り光 受光面

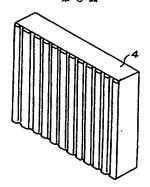
第 2 図







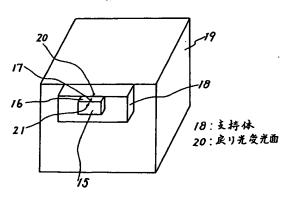
第6図



特開昭62-26653(4)

第7因 110000 0000 0000 0000 0000

第8図



手 続 補 正 沓 (自発) 60 10 4 昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 60-166510号



2. 発明の名称

光検知器

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住所氏名

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 增 雄 (連絡先03(213) 3421 特許部)



方式 ①



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の傷

6. 補正の内容

明細書中第5頁第7行に「反射されるととない」とあるのを「反射されることがない」と訂正する。

以上